

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
младшего научного сотрудника

в лаборатории диагностики материалов и структур твердотельной электроники
Вакансия VAC_PTI_22082

Тематика исследований

Экспериментальные исследования методами рентгеновской дифракции структуры и микроструктуры материалов

Трудовая деятельность

- Проведение рентгенодифракционных измерений образцов в виде порошков и тонких плёнок.
- Рентгенофазовый анализ полученных дифрактограмм.
- Применение методик высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии для анализа и исследований физических процессов в полупроводниковых гетероструктур.
- Определение параметров строения плёнок (толщин и плотности слоёв, шероховатости поверхности и интерфейсов).
- Анализ полученных экспериментальных данных, с учетом протекающих физических процессов в наноструктурах, выбор базовых физических моделей для их описания.
- Подготовка и публикация статей по результатам научно-исследовательских работ в российских и зарубежных научных изданиях, участие с докладами в научных конференциях.
- Участие в выполнении работ и подготовке отчетов по научно-исследовательским проектам научных фондов, программам Минобрнауки, других министерств и ведомств РФ и хозяйственным с индустриальными партнерами.
- Подготовка к регистрации результатов интеллектуальной деятельности.

Требования к претенденту

- Наличие высшего профессионального физико-технического образования и стажа работы по специальности не менее 3 лет;
- Понимание фундаментальных физических процессов взаимодействия рентгеновского излучения с материалами.
- Опыт работы в области физики и технологии материалов твердотельной электроники и приборов на их основе.
- Наличие опыта моделирования физических процессов в материалах с использованием вычислительных пакетов Comsol Multiphysics, Ansys, SolidWorks, Gaussian, Quantum ESPRESSO, Materials Studio, Gromacs, LAMMPS.
- Навыки экспериментальных исследований наноматериалов и структур.
- Наличие публикаций в журналах, индексируемых Scopus и WoS не менее 10 за последние 5 лет;
- Опыт участия в научных проектах в качестве исполнителя;

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

- ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 24 752 руб.
- СТАВКА: 1.0
- СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.
- Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, учёному секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.